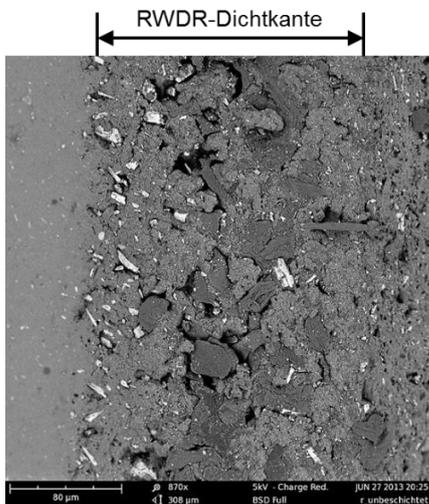
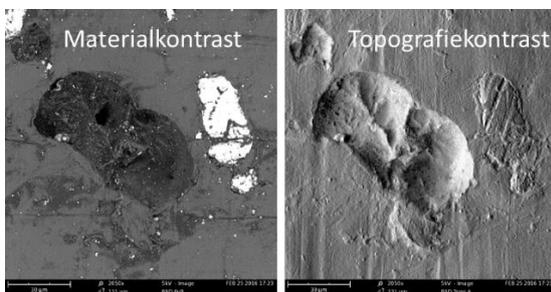




Phenom ProX mit EDX



Dichtkante, unbeschichtet in  
BSE Materialkontrast-Darstellung



Einlagerung in einem  
PTFE-Dichtring

## Beschreibung:

- Intuitiv und schnell bedienbares „All-in-One“ Desktop-Rasterelektronenmikroskop
- Chemische Materialanalyse durch Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX), Punktanalyse, Linescan und Mapping
- Erlaubt eine Betrachtung mit hoher Auflösung bei starker Vergrößerung (120x-45.000x)
- Lichtmikroskop zur Dokumentation und Probenavigation integriert
- Niederdruck-Modus erlaubt nichtleitfähige Proben ohne Bedampfung zu betrachten
- Darstellung im Material- und Topografiekontrast
- Um Proben mit einer leitfähigen Goldschicht zu bedampfen steht ein Sputtercoater Balzer SCD 050 zur Verfügung

## Technische Daten:

Vergrößerung:	120x- 45.000 x
REM-Detektor:	4-Quadranten-Rückstreuelektronen-Detektor (BSE)
Elektronenquelle:	CeB6 (Cerhexaborid)
Auflösung 7x7 Pixel:	25 nm
Probengröße:	max. ø25mmx20mm
EDX Energieauflösung	140 eV
Detektierbare Elemente:	Kohlenstoff (6) bis Americium (95)

## Untersuchungsmöglichkeiten

- Chem. Materialanalyse, Partikelanalyse
- Topografieanalyse (3D-Eindruck)
- Messung geometrischer Größen
- Tiefscharfe Darstellung von Proben bei hoher Vergrößerung